

全国表面化学分析标准化技术委员会

工作进展：

第一届全国表面化学分析标准化技术委员会

推荐性国家标准立项申请预审查会议

2025年6月27日，第一届全国表面化学分析标准化技术委员会（SAC/T C608）关于4项推荐性国家标准立项申请预审查会议以线上会议方式召开。本届委员33人，实际参会委员25人，列席会议10人。

会议听取了4项拟申请国家标准立项计划的申请报告，在进行充分答辩与讨论的基础上，对4项立项计划提出了修改意见和申报建议。具体如下：

- (1) 《表面化学分析 深度剖析 XPS 测量硅上氧化硅薄膜界面的方法》（季华实验室等，范燕，制定），经专家委员讨论建议修改计划名称为《表面化学分析 深度剖析 XPS 确定硅和氧化硅界面》，同时建议按委员会提出意见补充完善有关试验验证的数据分析，于7月3日前将修改后的申请材料提交至秘书处；
- (2) 《表面化学分析 碳化硅中痕量元素测定 辉光放电质谱法》（宁波新材料测试评价中心有限公司等，时晓露，制定），经专家委员讨论建议修改标准名称为《表面化学分析 辉光放电质谱 高纯碳化硅杂质元素的测定》，同时建议按委员会提出意见补充完善测量精密度等相关内容，于7月3日前将修改后的申请材料提交至秘书处；
- (3) 《表面化学分析 光谱椭偏术 纳米岛状薄膜测量方法》（华中科技大学等，王健，制定），建议按委员会提出意见补充完善有关方法验证等内容并完成标准草案，于7月3日前将修改后的申请材料提交至秘书处；
- (4) 《表面化学分析 表面增强拉曼散射光谱标准卡片（SERSCard）的建立方法》（清华大学等，王祎鹏，制定），经专家委员讨论建议修改标准名称为《表面化学分析 表面增强拉曼散射光谱 SERSCard 建立的方法》，同时建议按委员会提出意见补充完善申请材料的内容并完成标准草案，于7月3日前将修改后的申请材料提交至秘书处。

全国表面化学分析标准化技术委员会

全国表面化学分析标准化技术委员会

2025 年 6 月 27 日